ROVATVEZETŐK: dr. Buzáné dr. Dénes Margit és dr. Dévényi László

SEPSI MÁTÉ – BENKE MÁRTON – HLAVÁCS ADRIENN – MERTINGER VALÉRIA

Új, roncsolásmentes kristálytani anizotrópia vizsgálati módszer

A textúra jellemzése az ipari felhasználás során főleg a mélyhúzásra szánt alapanyaggyártásnál kulcskérdés. Hagyományos textúramérés laboratóriumi környezetben megvalósítható módszer, melynek a legfőbb korlátja a minta mérete és geometriája. Ez pedig a goniométer rögzített mivoltából, és az Euler-bölcső befoglaló méreteiből fakad. A maradó feszültség mérésére kifejlesztett röntgendiffraktométereknél az egyik legfőbb konstrukciós szempont, hogy a változatos geometriájú és méretű alkatrészeket akár ipari körülmények között is roncsolásmentesen (mintakivágás nélkül) lehessen velük vizsgálni. A maradó feszültségmérés és a textúramérés közti hasonlóságot kihasználva kidolgoztunk egy vizsgálati módszert központ nélküli diffraktométerre, aminek segítségével roncsolásmentesen tudunk anizotrópia jellemzést megvalósítani.

A kristálytani anizotrópia fogalma, jelentősége és meghatározásának módjai

Textúrának nevezzük a polikristályos fémekben a kristályok orientációjának a véletlenszerűtől való eltérését [1]. A kristályok nem véletlenszerű orientációja anizotróp (térben irányfüggő) tulajdonságokat eredményez. Az anizotrópiának kitüntetett gyakorlati jelentősége például a mechanikai és a mágneses tulajdonságoknál van. Az 1. ábra mágnesezési irányfüggésre, míg az 1. táblázat a rugalmassági modulus függőségre mutat példát.

1. táblázat. Tiszta fémek rugalmassági modulus értékének irányfüggése [4]

Fém	Rugalmassági modulus, GPa			
	[100]	[110]	[111]	
AI	63,7	72,6	76,1	
Cu	66,7	130,3	191,1	
Fe	125	210,5	272,7	

A létrehozó technológiától függően megkülönböztetünk alakítási, újrakristályosodási és öntési textúrát. Az önté-

Sepsi Máté szakmai életrajzát 2016/3. számunkban közöltük.

Dr. Benke Márton és Hlavács Adrienn szakmai életrajzát 2019/1. számunkban közöltük.

Dr. Mertinger Valéria szakmai életrajzát 2017/2. számunkban közöltük.

26



1. ábra. Transzformátorlemezek mágnezesezési görbéjének függése a kristálytani iránytól [2] és a hozzá tartozó nevezetes Goss- és kockatextúrák [3]

si textúra alakulását a hőelvonás iránya, illetve a csíraképződési feltételek szabják meg, hogy a szilárd fázis szemcséi milyen irányban növekednek. Az alakítási textúra létrejöttében nagyon fontos szerepet játszik a diszlokációs csúszás, ami a fémekben az atomsíkok elmozdulását, valamint a szemcsék alakváltozását eredményezi [5, 6, 7]. A diszlokáció csúszása okozta atomsík-elmozdulás kitüntetett rácssíkon, kitüntetett irányban zajlik. A fentebb említettek alapján, ha a fémet alakítjuk, a kristályok a számukra kedvező pozícióba fordulnak, így anizotrópiát okozó kristályorientáció jön létre. A kristálytani textúra egyik leglátványosabb hatása a mélyhúzásnál je-

lentkezik, ahol a félkész termék vastagságát meleg- vagy hideghengerléssel érik el (pl. lemez). A félkész terméket erős alakítási textúra jellemzi, emiatt erős az anizotrópiája, ami a mélyhúzásnál fülesedést okoz (2. ábra). Az erős alakítási textúra csökkentése érdekében alkalmazhatunk lágyító hőkezeléseket, azonban a lágyító hőkezelések során számolni kell az újrakristályosodási textúra létrejöttével. Az újrakristályosodott szerkezet is anizotróp lesz, mivel az újrakristályosodás is kitüntetett síkok mentén fog végbemenni. A minimális fülesedést az alakítási és újrakristályosodási textúra kombinációjával valósíthatjuk meg. Az 1. ábra transzformátorlemezénél mutatott nagy gyakorlati jelentőséggel bíró Gosstextúra is melegalakítással hozható létre. Annak ellenére, hogy az elmúlt 50 évben intenzíven kutatott terület volt ezen textúra kialakulása, még a mai napig is vannak nyitott kérdések [8].

A kristálytani anizotrópiát gyakran összekeverik a szemcsealak (morfológiai) anizotrópiával, mely szintén jellemzően hidegalakításkor alakul ki és mikroszkópi képeken is jól láthatóvá tehető. Vannak olyan metallográfiai módszerek, amelyek a kristálytani anizotrópiát és a morfológiai anizotrópiát próbálják jellemezni. Ilyen például az alumíniumötvözeteknél alkalmazott Barker színes maratási technika, aminél a különböző irányítottságú szemcséken különböző vastagságú csapadék képződik, melyet polarizált fényben különböző színűnek látunk. Erre mutat példát az egyik mintadarabról a 3. ábra. Az azonos orientációjú

szemcsék azonos szürkeségi fokúak. A Barker-maratás által nyújtott kvalitatív információ nem bizonyul elégségesnek azoknál a problémáknál, ahol a kristálytani textúrának jelentős szerepe van, ilyenkor kvantitatív módon kell meghatározni azt. Erre egy lehetséges mód, amivel kísérletet tehetünk: meg kell határoznunk egy kötött koordináta-rendszert, amiben az egyes szemcsék orientációját értelmezni tudjuk. Ezt a koordináta-rendszert célszerű a mintához rendelni, mégpedig úgy, hogy a koordináta-rendszer tengelyei egybeessenek a minta jellemző irányaival. Így egy hengerelt mintánál értelmezhető hengerlési irány (HI), keresztirány (KI), és normálirány (NI). Ebben a kötött koordináta-rendszerben egy szemcse orientációját úgy értelmezzük, hogy a szemcsét annak egy elemi cellájával helyettesítjük, és ezen elemi cella valamely (hkl) síkjának normálisát jellemezzük a 4. ábra szerinti módon az α -, β - és γ -szögek segítségével.

Az α-szög nem más, mint a (hkl) sík normálisának a minta NI-vel bezárt



2. ábra. Fülesedés megjelenése mélyhúzásnál (saját felvétel)



3. ábra. Textúra jellemzése alumíniumban



4. ábra. Elemi cella pozíciójának megadása hengerelt lemezben [9]

 $(90^{\circ} - \alpha)$ szög komplementer szöge, a β -szög a (hkl) sík normálisának a HI és KI által meghatározott síkban HI-vel bezárt szöge, valamint γ -szög, ami a (hkl) sík normálisa körüli forgatásként értelmezhető. Amennyiben polikristályos az anyagunk, ugyanezen paraméterekkel jellemezhető valamennyi szemcséje. Ezen értelmezés szerint elviekben egy polikristályos anyag valamennyi kristályának orientációja megadható a T*(α , β , γ , hkl) sűrűségfüggvénnyel. Azonban a gyakorlatban megvalósítható méréstechnikákkal ezen értelmezés kiegészítésre szorul.

Nem véletlen az, hogy ez a megközelítés a kristály orientációját, annak egy elemi cellájának valamely síkjával és annak normálisával jellemzi. A diffrakciós módszereknél ezen (hkl) síkok, egészen pontosan {hkl} síkrendszer térbeli eloszlása mérhető. Azonban a gyakorlati méréstechnikával csak az α - és β -szögek határozhatók meg, a γ -szög szerinti elfordulás egy bizonytalanságként jelentkezik. Így azonban, a már ismertetett T*(α , β , γ , hkl) függvény szerinti ábrázolási mód nem alkalmazható. Helyette T*(α, β , hkl) ábrázolási módot választhatunk, ami egy félkvantitatív textúrajellemzés, az így kapott függvényünk pedig a pólusábra, mely a mérnöki gyakorlatban talán a leqqyakrabban alkalmazott anizotrópia jellemzési mód. A 3. ábra a hengerelt és az újrakristályosodott alumíniumlemez {200} síkrendszerről készült pólus-

ábráját mutatja. A pólusábra konvencionális felvétele során a mintát döntjük és forgatjuk, és detektáljuk az adott síksorozatról diffraktált interferenciafüggvény intenzitásváltozását. Ehhez a mintát a konvencionális diffraktométer mintatartójába kell helyezni, ami egy kb. 40 mm átmérőjű, maximálisan 10 mm vastagságú lemez befogadására képes, ami azt jelenti, hogy a mintát roncsolásosan kell kivágni. Ez sok esetben, például értékes mintadarab esetén nem lehetséges. Ezért dolgoztuk ki a roncsolásmentes pólusábra mérési módszert központ nélküli röntgendiffraktométerre.

Teljes pólusábra felvételére alkalmas textúra mérési módszer kidolgozása központ nélküli röntgendiffraktométerre

A hordozható feszültségmérő diffraktométerek központ nélküliek, vagyis nem a minta, hanem a berendezés mozgatását valósítják meg. Ez adta az ötletet, hogy ezt a berendezéscsaládot alkalmazzuk anizotrópia vizsgálat-

ra is anélkül, hogy roncsolnánk a darabot. Hogy a két módszer közötti átjárás miért nem nyilvánvaló és triviális, azt az 5. ábra mutatja. Azzal, hogy a központ nélküli diffraktométernél a sugár merőlegesen esik a minta felületére, a mért síksorozat normálisa (ami nem más, mint a mérési irány) a minta felületének normálisával ɛ-szöget zár be. Konvencionális diffraktométernél ugyanazon Miller-indexű síksorozatok közül azokat fogjuk detektálni, amelyek normálisa megegyezik a minta felületének normálisával. Vagyis a két mérés során nem azonos pozícióban lévő síksorozatokat detektálunk, így a két módszerrel meghatározott térbeli eloszlásfüggvény különbözni fog.

Kutatómunkánkban azt tűztük ki célul, hogy meghatározzuk azokat az összefüggéseket, amelyek segítségével elvégezhető a központ nélküli diffraktométerrel a mérés ugyanazon pozícióban lévő síksorozatok detektálásával, mint konvencionális mérés esetében. Ezen összefüggések meghatározása a lehetséges goniométer elrendezési összeállításokra megtörtént [10]. Jelen munkánkban egy olyan ipari felhasználású, gyakorlati példát mutatunk be, ahol a teljes pólusábra meghatározására nincs is szükség. A 2. ábrán mutatott fülesedés jelenségét szabványosított csészehúzó próbával lehet jellemezni. A próbát viszont 3 mm-nél vastagabb lemezből már nem lehet elvégezni, ezért felmerült az igény az ilyen vastag lemezek fülesedésének becslésére. A becsléshez szükséges számításokhoz a pólusábra jellegzetes metszeteinek a felvétele is elegendő.

Ha megvizsgáljuk az 5. ábra szerinti sugármenetet, akkor a következőkre

lehetünk figyelmesek. A konvencionális X mód során $\varphi = 0^{\circ}$ forgatás mellett az X tengely és a KI egybeesnek, ezért, ha e tengelyek mentén döntünk, a mérési irányunk a HI mentén változik. Ahhoz, hogy a mérési irány az általunk használt központ nélküli diffraktométer Ω módjában is a HI-ba változzon, a mintánkat úgy kell pozícionálni, hogy a HI és az Ω módban felhelyezett detektorok síkja egy síkba essen. Ekkor a mérésünket valóban ugyanabban a

28



5. ábra. Sugármenet konvencionális (Bruker) és központ nélküli (Stresstech) goniométerben



6. ábra. Hengerelt 3103 típusú alumíniumötvözet {222} pólusábrái különböző vastagságcsökkenés után (5,74–0,45 mm)

síkban hajtjuk végre. Azonban ezen feltétel teljesítése még nem elegendő, ugyanis - amint azt az 5. ábra szemlélteti – ω ' = 0° döntés mellett ε értékkel tér el a mérés iránya a χ = 0° döntéshez képesti mérési iránytól, ami a konvencionális konfiguráció 0 döntési pozíciójának felel meg. Fontos azonban megemlíteni, hogy maradó feszültség mérésére kifejlesztett berendezések Ω módjának sugármenete nem azonos a konvencionális diffraktométerek Ω módjának sugármenetével. A konvencionális berendezések esetében ω a primér nyaláb és a minta felülete közötti szög, míg jelen esetben w' a minta felületének normálisa

2. táblázat. A pólusábra-mérések körülményei

Vizsgáló berendezés	Bruker D8 Advance	Xstress G3R
Vizsgált minta jelölése:	H17	H17
Anyaga:	Alumínium	Alumínium
Termomechanikus kezelés állapota:	Hidegen hengerelt	Hidegen hengerelt
Bragg-pozíció (311);(222):	94,2°; 99,8°	156,19°
Alkalmazott sugárforrás:	Co röntgencső	Cr röntgencső
Gyorsító feszültség; fűtőáram:	40 kV; 40 mA	30 kV; 8 mA
Kollimátor:	Bragg-szögtől függ 20*(1-3) mm	5 mm
Expozíciós idő:	5 s	2 s

és a primer röntgennyaláb által bezárt szög. Itt ω ' = 0° a kiinduló állapot, és ekkor a mérési irány a minta normálisával ε -szöget zár be. Következésképpen, szoftveresen is ehhez a kiinduló állapothoz képest lehet megadni a "Tilt Angles" név alatt a döntésszögeket pozitív és negatív tartományban. Az ε -szöget a Bragg-szögből származtatjuk. Mivel a primer és diffraktált nyaláb által bezárt szög a 2 θ komplementer szöge így a

$$\varepsilon = (180 - 2\theta)/2 \tag{1}$$

szerint alakul. Ezen összefüggés ismeretében egy tetszőleges χ i-szög a

$$\chi i = \pm \omega' i \pm \varepsilon$$
 (2)

szerint számolható, annak függvényében, hogy a diffraktált nyaláb hol helyezkedik el a primerhez képest. Az 5. ábra c) képén jól látszik, hogy a G3R diffraktométeren két detektor van. Mérés közben lehetőségünk van csak az egyik,



7. ábra. Hengerelt 3103 típusú alumíniumötvözet {222} pólusábráinak hengerlési irányú χ -metszetei a) konvencionális; és b) központ nélküli diffraktométerrel meghatározva különböző vastagságcsökkenés (5,74–3,04 mm) után



8. ábra. Hengerelt 3103 típusú alumíniumötvözet {222} pólusábráinak hengerlési irányú γ-metszetei a) konvencionális; és b) központ nélküli diffraktométerrel meghatározva különböző vastagságcsökkenés (2,05–0,45 mm) után

vagy mindkét detektort aktívvá tenni. Az Ω mód esetén a mérési irányok eltérők (egymás inverzei) a két detektorra. Amennyiben az "A" detektor által mért reflexiót vizsgáljuk, úgy az ε előjele negatív, ha a "B" detektorét, akkor az ε a pozitív, az ω'pozitív és negatív előjellel egyaránt rendelkezhet egy mérés során.

Ezen összefüggések elegendőnek bizonyultak, hogy bizonyítsuk feltevésünket, mely szerint a központ nélküli

maradó feszültség mérésére kifejlesztett berendezéssel is vizsgálhatók ugyanazon mérési irányok, mint a konvencionális berendezésekkel, és validáló χ -metszeteket készíthettünk. Méréseinket először a Bruker D8 Advance központos diffraktométerrel kezdtük, és kimértük azokat a reflexiókhoz tartozó pólusábrákat, mely reflexiót a Xstress G3R is lát. A vizsgálatok körülményeit a 2. táblázat foglalja össze. A konvencionálisan meghatározott pólusábrákat a különböző vastagságúra hengerelt lemez esetén a 6. ábra mutatja. Ezen χ-metszetek értékeit pedig a konvencionális és a központ nélküli mérési módszerrel meghatározva a 7. és a 8. ábra mutatja.

Az így, akár roncsolásmentesen meghatározott χ -metszet értékekből egy már korábban bemutatott módszer segítségével [11] a fülesedés értéke becsülhető. Egy ilyen diagramot mutat be a 9. ábra.

Összefoglalás

Munkánkban egy általunk kidolgozott roncsolásmentes textúramérési módszert és annak ipari alkalmazását mutattuk be. A módszer segítségével nagy értékű és/vagy roncsolásos mintavételi eljárás nélkül tudunk pólusábrát, vagy annak speciális metszeteit felvenni. A bemutatott vizsgálatsorozat eredménye szerint az új és konvencionális vizsgálótechnikával teljesen egyenértékű eredmények kaphatók. A mérési módszer segítségével vastagabb lemezek fülesedésének becslése is lehetséges. A vizsgálati módszer jövőbeni alkalmazását nagy értékű, szupravezető nióbium termomechanikus kezelésének monitorozására kívánjuk használni a Miskolci Egyetem és a CERN közötti együttműködés keretében megvalósuló kísérletek során.

Köszönetnyilvánítás

A cikkben ismertetett kutatómunka az NKFIH K119566 projekt és az EFOP-3.6.1-16-00011 jelű "Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése" projekt részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai

29

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Irodalom

- Bárczy, P., & Fuchs, E. (1981). Metallográfia I. Budapest: Tankönyvkiadó
- [2] Callister, W. D. (2007). Material Science and Engineering, an Introduction. USA: John Wiley & Sons
- [3] Raabe, D. (2016). http:// www.dierk-raabe.com/. Forrás: http://www. dierk raabe.com/
- [4] *Callister, W. D.* (2007). Material Science and Engineering, an Introduction. USA: John Wiley & Sons
- [5] Kocks, U. F., Tomé, C. N., & Weng, H. R. (1998). Texture and anisotropy. UK: Cambridge University Press
- [6] Engler, O., & Randle, V. (2010). Int-





roduction to texture analysis. CRC Press

- [7] *Suwas, S., & Ray, K. R.* (2014). CrystallographicTexture of Materials. London: Springer-Verlag
- [8] Dorner, D., Zaefferer, S., Lahn, L., & Raabe, D. (2006). Overview of Mic-

rostructure and Microtexture Deve-lopment in Grain-oriented Silicon Steel. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 183–186.

- [9] Krawitz, A. D. (2001). Introduction to Diffraction in Materials Science and Engineering. New York: John Wiley&Sons
- [10] Sepsi M, Hlavács A, Mertinger V, Benke M. (2018) Industrial application of a quick, nondestructive anisotropy characterisation method IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 426 012042
- [11] Benke, M., Hlavács, A., Piller, I., & Mertinger, V. (2019). Lemezek fülesedése és a {h00} pólusábrák közötti kapcsolat. BKL Kohászat, 152(2019/1), 36–39.

KERESZTES ZOLTÁN – SZABÓ PÉTER JÁNOS

DMLS technológiával gyártott 316L orvostechnikai acél mágneses tulajdonságainak vizsgálata

A 316L acél egy olyan speciális korrózióálló acélfajta, amit gyakran alkalmaznak az orvostechnikában. Ennek oka az olyan tulajdonság, mint a biokompatibilitás, allergiamentesség, és ausztenites szerkezetéből fakadóan nem rendelkezik mágneses tulajdonságokkal. Ezen előnyös tulajdonságok egyike megváltozhat, amenynyiben a manapság egyre jobban teret hódító DMLS (Direct Metal Laser Sintering, Direkt Fém Lézer Szinterelés) additív gyártástechnológiát választjuk. A por alapanyagot a munkaasztalra terítve lézer segítségével szintereljük. A folyamat végén egy egyedi, komplex geometriájú munkadarabot kapunk, amely hajlamos mágneses tulajdonságokat mutatni a por alapanyaggal szemben. Az orvostechnikában jóformán lehetetlen megfelelő számú és minőségű kritériumot állítani az alkalmazott fémekkel szemben, de a mágneses jelenségek fennállása az alapanyag azonnali kizárását vonja maga után. Jelen publikáció a DMLS technológia bemutatása mellett az említett berendezéssel gyártott próbatest mágneses tulajdonságait vizsgálja. Az összehasonlíthatóság miatt egy hagyományosan készített 316L munkadarabot is azonos kísérleti körülmények között vizsgáltunk meg. Az EOS M 100 piacvezető DMLS technológiát alkalmazó berendezésével 20 µm szemcseméretű 316L por alapanyagból készítettük a próbatesteket. A technológiai paraméterekhez a Ø 100 × 95 mm hengeres munkatér, 71 W-os Yb-lézer, 821 mm/s szkennelési sebesség és 20 µm vastagságú rétegek tartoztak. A gyártás Ar-gáz környezetében történt. A mágneses mérésnél mindkét típusú próbatestet először lemágneseztük. Ezután a mágneses indukció és a mágneses térerősség mérésével felvettük a hiszterézisgörbéket, majd folyékony nitrogénben történő próbatesthűtés után ismételtük a méréseket.

Bevezetés

30

Korrózióálló acélokat széles körben használnak az ipar számos területén. A ferrites és martenzites acélok ferromágnesesen viselkednek, míg az ausztenites acél paramágneses anyag [1]. Munkánkban az utóbbi típussal, a 316L ausztenites, korrózióálló acéllal foglalkozunk. Felhasználását tekintve széles körben megtalálhatóak olyan területeken, mint az épületgépészet, autóipar, háztartási eszközök, hadiipar, orvostechnika [2]. Minden felhasználási terület magában foglalja a sajátos követelményeit, de az orvostechnika speciális eset, lényegében a biológia és a mérnöki tudományok összekapcsolása, ahol egy ősi álom elérése a cél. Ez a feladat pedig az, hogy bármilyen nem megfe-